# Best Available Copy

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-008111

(43) Date of publication of application: 12.01.2001

(51)Int.CI.

HO4N 5/335

(21)Application number: 11-179548

H01L 27/146

(22)Date of filing:

25.06.1999

(71)Applicant : MINOLTA CO LTD

(72)Inventor: YANO TAKESHI

KAKUMOTO KENICHI KUSAKA YASUSHI

### (54) SOLID STATE IMAGE PICKUP DEVICE

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solid state image pickup device capable of automatically switching the linear transformation operation and logarithmic transformation operation of an electric signal corresponding to incident light upon a solid state image pickup element in accordance with the luminance of a subject whose image is to be picked up.

SOLUTION: When the luminance of a subject detected by a luminance signal sent from an area sensor (solid state image pickup element) 3 is brighter than a certain fixed value (e.g. 700 cd/m2), a switching judgment circuit 5 judges that the area sensor 3 is allowed to execute logarithmic transformation operation. A switching signal is sent from a switching signal generation circuit 6 on the basis of the judgment of the circuit 5 and the sensor 3 executes logarithmic transformation operation. When the luminance of the subject is darker than the fixed value (e.g. 700 cd/m2), the circuit 5 judges that the sensor 3 is allowed to execute linear transformation operation. Thereby a switching signal is sent from the circuit 6 on the basis of the judgment of the circuit 5 and the sensor 3 executes in the sensor 3 execute

the circuit 6 on the basis of the judgment of the circuit 5 and the sensor 3 executes linear transformation operation.



[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

## (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

### 特開2001-8111

(P2001-8111A)(43)公開日 平成13年1月12日(2001.1.12)

(51) Int. C1.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 4 N

5/335 H 0 1 L 27/146 H 0 4 N 5/335 Q 4M118

H 0 1 L 27/14 A 5C024

審査請求 未請求 請求項の数11

ΟL

(全15頁)

(21)出願番号

特願平11-179548

(22)出願日

平成11年6月25日(1999.6.25)

(71)出願人 000006079

ミノルタ株式会社

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号

大阪国際ビル

(72)発明者 矢野 壮

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪

国際ピル ミノルタ株式会社内

(72)発明者 角本 兼一

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪

国際ビル ミノルタ株式会社内

(74)代理人 100085501

弁理士 佐野 静夫

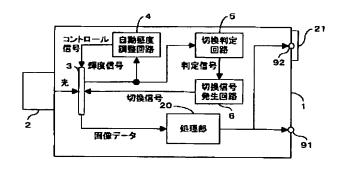
最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】固体撮像装置

### (57)【要約】

【課題】本発明は、撮像する被写体の輝度に応じて、固 体撮像素子の入射光に対する電気信号の線形変換動作と 対数変換動作とを、自動的に切り換えることができる固 体撮像装置を提供することを目的とする。

【解決手段】エリアセンサ(固体撮像素子) 3より送出 される輝度信号によって検出される被写体の輝度がある 一定の値 (例えば、 $700cd/m^2$ ) よりも明るくな るとき、切換判定回路5がエリアセンサ3を対数変換動 作させるべきであると判定する。この切換判定回路5の 判定によって切換信号発生回路 6 より切換信号が送出さ れてエリアセンサ3が対数変換動作を行う。又、エリア センサ3より送出される輝度信号によって検出される被 写体の輝度がある一定の値(例えば、700cd/ m²) よりも暗くなるとき、切換判定回路5がエリアセ ンサ3を線形変換動作させるべきであると判定する。こ の切換判定回路5の判定によって切換信号発生回路6よ り切換信号が送出されてエリアセンサ3が線形変換動作 を行う。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 入射光量に応じた電気信号を発生する固体撮像素子を有する固体撮像装置において、

前記固体撮像素子から得られる輝度信号に基づいて前記 固体撮像素子の動作状態を、前記電気信号を線形的に変 換する第1状態と、自然対数的に変換する第2状態とに 切り換える切換手段を備えることを特徴とする固体撮像 装置。

【請求項2】 入射光量に応じた電気信号を発生する固体撮像素子を有する固体撮像装置において、

該固体撮像素子から得られる輝度信号に基づいて感度調整を行う感度調整部を有し、

前記固体撮像素子の動作状態を、前記電気信号が入射光量に対して線形的に変換されて出力される第1状態と、自然対数的に変換されて出力される第2状態とに切り換え可能とするとともに、

前記輝度信号に基づいて前記固体撮像素子の動作状態を 切り換える切換手段を有することを特徴とする固体撮像 装置。

【請求項3】 前記輝度信号により被写体の輝度が暗いとき、前記固体撮像素子の動作状態を第1状態にし、

前記輝度信号により被写体の輝度が明るいとき、前記固体撮像素子の動作状態を第2状態にすることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の固体撮像装置。

【請求項4】 前記切換手段が、2値の電圧信号となる 切換信号を発生し、

該切換信号によって、前記固体撮像素子の動作状態が切り換えられることを特徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載の固体撮像装置。

【請求項5】 入射光量に応じた電気信号を発生する固体撮像素子を有する固体撮像装置において、

前記固体撮像素子の動作状態を、前記電気信号が入射光量に対して線形的に変換されて出力される第1状態と、 自然対数的に変換されて出力される第2状態とに切り換え可能とするとともに、

固体撮像素子にて発生する電気信号に基づいて、被写体 の輝度範囲を検出する輝度範囲検出手段を設けて、被写 体の輝度範囲に応じて、前記固体撮像素子の動作状態を 切り換えることを特徴とする固体撮像装置。

【請求項6】 被写体の輝度範囲が狭いとき、前記固体 40 撮像素子の動作状態を第1状態にし、

被写体の輝度範囲が広いとき、前記固体撮像素子の動作 状態を第2状態にすることを特徴とする請求項5に記載 の固体撮像装置。

【請求項7】 前記輝度範囲検出手段が、

固体撮像素子から送出される電気信号のレベルの大小を 順次比較してその最大値と最小値を検出し、この電気信 号のレベルの最大値と最小値の差に応じて前記固体撮像 素子の動作状態を第1状態にするか第2状態にするか判 定する切換判定手段と、 切換判定手段によって判定された結果に応じて、前記固 体撮像素子の動作状態を切り換える切換信号を発生する 切換信号発生手段と、

2

を有することを特徴とする請求項5又は請求項6に記載 の固体撮像装置。

【請求項8】 前記切換信号が、2値の電圧信号であることを特徴とする請求項7に記載の固体撮像装置。

【請求項9】 前記固体撮像素子が、

第1電極に直流電圧が印加された感光素子と、

10 第1電極と第2電極と制御電極とを備え、第1電極及び 制御電極が前記感光素子の第2電極に接続され、前記感 光素子からの出力電流が流れ込むトランジスタと、を有

前記トランジスタの第1電極と第2電極の間の電位差を変化させることによって、前記固体撮像素子の動作を、第1状態と第2状態とに切り換えることを特徴とする請求項1~請求項8のいずれかに記載の固体撮像装置。

【請求項10】 前記固体撮像素子が、

第1電極に直流電圧が印加された感光素子と、

20 第1電極と第2電極と制御電極とを備え、第1電極が前 記感光素子の第2電極に接続され、前記感光素子からの 出力電流が流れ込むとともに、第2電極と制御電極とが 接続されたトランジスタと、を有し、

前記トランジスタの第1電極と第2電極の間の電位差を変化させることによって、前記固体撮像素子の動作を、第1状態と第2状態とに切り換えることを特徴とする請求項1~請求項8のいずれかに記載の固体撮像装置。

【請求項11】 前記固体撮像素子が、

第1電極に直流電圧が印加された感光素子と、

30 第1電極と第2電極と制御電極とを備え、制御電極に直 流電圧が印加されるともに、第1電極が前記感光素子の 第2電極に接続され、前記感光素子からの出力電流が流 れ込むトランジスタと、を有し、

前記トランジスタの第1電極と第2電極の間の電位差を変化させることによって、前記固体撮像素子の動作を、第1状態と第2状態とに切り換えることを特徴とする請求項1~請求項8のいずれかに記載の固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、入射光に対する電気信号の線形変換と対数変換を行える固体撮像素子を有する固体撮像装置に関するもので、特に1つの固体撮像素子で線形変換動作と対数変換動作とを切り換えて行うことが可能な固体撮像装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、フォトダイオードなどの感光 素子をマトリクス状に配置したエリアセンサ等の固体撮 像素子は、その感光素子に入射された光の輝度に対し て、線形的に変換した信号を出力する。このように線形 50 変換を行うエリアセンサ(以下、「リニアセンサ」と呼

ぶ。)は、例えば、レンズの絞りを調整することにより、被写体の最も明るい部分(ハイライト部)を撮像する感光素子がその最大レベルの90パーセント程度のレベルの電気信号として出力できるように、調節される。このようなリニアセンサを用いることによって、被写体の輝度分布においてその最小値を $Lmin[cd/m^2]$ 、その最大値を $Lmax[cd/m^2]$ としたとき、被写体の輝度範囲 Lmax/Lmin が2 桁以下の狭い範囲であれば階調性豊かに被写体の情報を取り込むことができる。

【0003】それに対して、本出願人は、入射した光量に応じた電流を発生する感光素子と、その電流を入力するMOSトランジスタをサブスレッショルド電流が流れうる状態にバイアスするバイアス手段とを備え、感光素子からの電流を対数変換するようにしたエリアセンサ(以下、「LOGセンサ」と呼ぶ。)を提案した(特開平3-192764号公報参照)。このようなLOGセンサは、被写体の最も明るい部分(ハイライト部)を撮像する感光素子がその最大レベルの90パーセント程度のレベルの電気信号として出力できるように、調節した場合、その輝度範囲 Lmax/Lmin が5桁~6桁の広い範囲となる被写体の情報を取り込むことができる。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記リニアセンサでは 撮像可能な輝度範囲が略2桁と狭いため、被写体に直射 日光が当たるなどの要因で被写体の輝度が明るくなり、 明部が感光素子が扱えるレベルを超えてオーバーフロー を起こすような状態になったとき、このレベルを超えた 明部の情報を取り込むことができず、白トビという現象 が起こる。又、この白トビを避けるために、取り込み可 能な輝度範囲を明部側にシフトして明部の情報を取り込 み可能とすると、逆に暗部の情報を取り込むことができ ず、黒ツブレという現象が起こる。

【0005】一方、LOGセンサの出力特性は図15のように対数関数を示す。そのため、このLOGセンサを用いたときは、高輝度部での階調性が乏しくなりやすく、例えば、明るい被写体に対しては、暗部及び明部の情報をともに取り込むことが可能であるが、暗い被写体に対しては、明部の階調性が乏しくなるなどの問題があった。

【0006】このような問題点を鑑みて、本発明は、被写体の明るさの状態にかかわらず常に良好な撮像を行うことができる固体撮像装置を提供することを目的とする。又、本発明は、固体撮像素子の入射光に対する電気信号の線形変換動作と対数変換動作とを、自動的に切り換えることができる固体撮像装置を提供することを目的とする。又、本発明の他の目的は、1つの固体撮像素子が前記線形変換動作と前記対数変換動作とを行う固体撮像装置を提供することである。更に、本発明の他の目的は、構成の簡単な固体撮像装置を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記の問題を達成するた めに、請求項1に記載の固体撮像装置は、入射光量に応 じた電気信号を発生する固体撮像素子を有する固体撮像 装置において、前記固体撮像素子から得られる輝度信号 に基づいて前記固体撮像素子の動作状態を、前記電気信 号を線形的に変換する第1状態と、自然対数的に変換す る第2状態とに切り換える切換手段を備えることを特徴 とする。又、請求項2に記載の固体撮像装置は、入射光 量に応じた電気信号を発生する固体撮像素子を有する固 体撮像装置において、該固体撮像素子から得られる輝度 信号に基づいて感度調整を行う感度調整部を有し、前記 固体撮像素子の動作状態を、前記電気信号が入射光量に 対して線形的に変換されて出力される第1状態と、自然 対数的に変換されて出力される第2状態とに切り換え可 能とするとともに、前記輝度信号に基づいて前記固体撮 像素子の動作状態を切り換える切換手段を有することを 特徴とする。

【0008】このような固体撮像装置によると、固体撮像素子が撮像する被写体の輝度に応じた輝度信号に基づいて、被写体の明るさの状態にあわせて、固体撮像素子の動作状態を切り換えることができる。又、請求項3に記載するように、被写体の輝度が暗いとき、前記固体撮像素子の動作状態を第1状態にし、被写体の輝度が明るいとき、前記固体撮像素子の動作状態を第2状態にすることによって、概して被写体全体の輝度範囲の狭い暗い状態では階調性の豊かな高品位の画像を、概して被写体全体の輝度範囲の広い明るい状態では白トビ又は黒ツブレの無い奥行きのある高品位の画像をそれぞれ撮像することができる。感度調整部を設けている場合は、いずれの出力状態の場合にも固体撮像素子の感度を適切に調整することができ、より好ましい状態で撮像が行える。

【0009】請求項4に記載の固体撮像装置は、請求項1~請求項3のいずれかに記載の固体撮像装置において、前記切換手段が、2値の電圧信号となる切換信号を発生し、該切換信号によって、前記固体撮像素子の動作状態が切り換えられることを特徴とする。このようにすることによって、固体撮像素子に設けられた素子のバイアスを変更して固体撮像素子の動作状態を切り換えることができる。

【0010】請求項5に記載の固体撮像装置は、入射光量に応じた電気信号を発生する固体撮像素子を有する固体撮像装置において、前記固体撮像素子の動作状態を、前記電気信号が入射光量に対して線形的に変換されて出力される第1状態と、自然対数的に変換されて出力される第2状態とに切り換え可能とするとともに、固体撮像素子にて発生する電気信号に基づいて、被写体の輝度範囲を検出する輝度範囲検出手段を設けて、被写体の輝度範囲に応じて、前記固体撮像素子の動作状態を切り換えることを特徴とする。

20

【0011】このような構成の固体撮像装置によると、 階調性の良い第1状態と、輝度範囲の広い被写体を撮像 可能な第2状態とを、検出した被写体の輝度範囲に応じ て切り換えることができる。又、請求項6に記載するよ うに、被写体の輝度範囲が狭いとき、前記固体撮像素子 の動作状態を第1状態にし、被写体の輝度範囲が広いと き、前記固体撮像素子の動作状態を第2状態にすること によって、被写体全体の輝度範囲の狭い状態では階調性 の豊かな高品位の画像を、被写体全体の輝度範囲の広い 状態では白トビ又は黒ツブレの無い奥行きのある高品位 の画像をそれぞれ撮像することができる。

【0012】請求項7に記載の固体撮像装置は、請求項5又は請求項6に記載の固体撮像装置において、前記輝度範囲検出手段が、固体撮像素子から送出される電気信号のレベルの大小を順次比較してその最大値と最小値を検出し、この電気信号のレベルの最大値と最小値の差に応じて前記固体撮像素子の動作状態を第1状態にするか第2状態にするか判定する切換判定手段と、切換判定手段によって判定された結果に応じて、前記固体撮像素子の動作状態を切り換える切換信号を発生する切換信号発生手段と、を有することを特徴とする。

【0013】このような固体撮像装置において、請求項8に記載するように、前記切換信号を2値の電圧信号とすることによって、固体撮像素子内に設けられた素子に印加するバイアス電圧の値を変化させることによって、固体撮像素子の動作を第1状態又は第2状態に切り換えることができる。

【0014】請求項9に記載の固体撮像装置は、請求項1~請求項8のいずれかに記載の固体撮像装置において、前記固体撮像素子が、第1電極に直流電圧が印加された感光素子と、第1電極と第2電極と制御電極とを備え、第1電極及び制御電極が前記感光素子の第2電極に接続され、前記感光素子からの出力電流が流れ込むトランジスタと、を有し、前記トランジスタの第1電極と第2電極の間の電位差を変化させることによって、前記固体撮像素子の動作を、第1状態と第2状態とに切り換えることを特徴とする。

【0015】請求項10に記載の固体撮像装置は、請求項1~請求項8のいずれかに記載の固体撮像装置において、前記固体撮像素子が、第1電極に直流電圧が印加された感光素子と、第1電極と第2電極と制御電極とを備え、第1電極が前記感光素子の第2電極に接続され、前記感光素子からの出力電流が流れ込むとともに、第2電極と制御電極とが接続されたトランジスタと、を有し、前記トランジスタの第1電極と第2電極の間の電位差を変化させることによって、前記固体撮像素子の動作を、第1状態と第2状態とに切り換えることを特徴とする。

【0016】請求項11に記載の固体撮像装置は、請求項1~請求項8のいずれかに記載の固体撮像装置において、前記固体撮像素子が、第1電極に直流電圧が印加さ

れた感光素子と、第1電極と第2電極と制御電極とを備え、制御電極に直流電圧が印加されるともに、第1電極が前記感光素子の第2電極に接続され、前記感光素子からの出力電流が流れ込むトランジスタと、を有し、前記トランジスタの第1電極と第2電極の間の電位差を変化させることによって、前記固体撮像素子の動作を、第1状態と第2状態とに切り換えることを特徴とする。

### [0017]

【発明の実施の形態】<第1の実施形態>本発明の第1の実施形態について、図面を参照して説明する。図1は、本実施形態で使用する固体撮像装置の要部の構成を示すブロック図である。図2及び図4は、図1に示す固体撮像装置に設けられた固体撮像素子であるエリアセンサの構造の1例を示すブロック図である。図3は、図2に示すエリアセンサ内の画素の構成の1例を示す回路図である。図6は、図4に示すエリアセンサ内の画素の構成の1例を示す回路図である。図6は、図4に示すエリアセンサ内の画素の構成の1例を示す回路図である。

【0018】図1に示す固体撮像装置1は、対物レンズ2と、該対物レンズ2を介して入射する光に応じて対数変換もしくは線形変換を行った電気信号を出力するエリアセンサ3と、エリアセンサ3より出力される電気信号が入力されこの電気信号に基づいて被写体の輝度を検知して感度調整を行う自動感度調整回路4と、前記電気信号(以下、「輝度信号」と呼ぶ。)より被写体の輝度を検知してエリアセンサ3を対数変換動作させるか線形変換させるかを判定するとともに判定信号を発生する切換判定回路5と、前記判定信号によってエリアセンサ3の対数変換動作と線形変換動作を切り換えるための切換信号をエリアセンサ3に送出する切換信号発生回路6と、エリアセンサ3から送出される電気信号を演算処理する処理部20とを有している。

【0019】尚、処理部20で処理された信号は、出力端子91から固体撮像装置1の外部へ出力され記録媒体への記録や表示装置への出力など種々の用途に供される。又、出力端子92からファインダー21へも与えられる。又、エリアセンサ3から処理部20に送出される電気信号を、以下、「画像データ」と呼ぶ。尚、自動感度調整回路4の詳細については後述し、図1においては自動感度調整回路4の周辺部分の構成は簡略的に図示している。

【0020】このような構成の固体撮像装置に設けられたエリアセンサ3の構成の一例について、図2を参照して説明する。同図において、G11~Gmnは行列配置(マトリクス配置)された画素を示している。 7は垂直走査回路であり、行(ライン)9-1、9-2、・・、9-nを順次走査していく。 8は水平走査回路であり、画素から出力信号線10-1、10-2、・・・、10-mに導出された光電変換信号を画素ごとに水平方向に順次読み出す。 11は電源ラインである。各画素に対し、上記ライン9-1、9-2、・・・、9-nや出

カ信号線10-1、10-2、・・・、10-m、電源 ライン11だけでなく、他のライン(例えば、クロック ラインやバイアス供給ライン等)も接続されるが、図2 ではこれらについて省略している。

【0021】出力信号線10-1、10-2、・・・、

10-mごとにNチャネルのMOSトランジスタQ1、 Q2、・・・、Qmが図示の如く1つずつ設けられてい る。トランジスタQ1、Q2、・・・、Qmのドレイン は、それぞれ出力信号線10-1、10-2、・・・、 10-mに接続され、ソースは最終的な信号線 12 に接 10 続され、ゲートは水平走査回路8に接続されている。 尚、後述するように各画素内にはスイッチ用のNチャネ ルの第4MOSトランジスタT4も設けられている。こ こで、トランジスタT4は行の選択を行うものであり、 トランジスタQ1~Qmは列の選択を行うものである。 【0022】更に、このようなエリアセンサ3内の画素 G11~Gmnの構成について、図3を参照して説明する。 図3において、pnフォトダイオードPDが感光部(光 電変換部)を形成している。そのフォトダイオードPD のアノードは第1MOSトランジスタT1のドレインと ゲート、第2MOSトランジスタT2のゲート、及び第 3MOSトランジスタT3のドレインに接続されてい る。トランジスタT2のソースは行選択用の第4MOS トランジスタT4のドレインに接続されている。トラン ジスタT4のソースは出力信号線10 (この出力信号線 10は図2の10-1、10-2、・・・、10-mに 対応する) へ接続されている。尚、トランジスタT1, T2, T3, T4は、いずれもNチャネルのMOSトラ

【0023】又、フォトダイオードPDのカソードには 直流電圧VPDが印加されるようになっている。一方、ト ランジスタT1のソースには信号 Ø VPSが印加され、ト ランジスタT2のソースにはキャパシタCの一端が接続 る。トランジスタT3のソースには直流電圧VRBが印加 る。トランジスタT2のドレインには信号 øD が入力さ れる。又、トランジスタT4のゲートには信号 ØVが入 力される。尚、本実施形態において、信号 Ø VPSは、2 値的に変化するものとし、トランジスタT1, T2をサ ブスレッショルド領域で動作させるための電圧をローレ ベルとし、直流電圧VPDと略等しい電圧をハイレベルと

ンジスタでバックゲートが接地されている。

【0024】このような構成の画素において、信号ΦV PSの電圧値を切り換えてトランジスタT1のバイアスを 変えることにより、出力信号線10に導出される出力信 号をフォトダイオードPDが入射光に応じて出力する電 気信号(以下、「光電流」という。) に対して自然対数 的に変換させる場合と、線形的に変換させる場合とを実 現することができる。以下、これらの各場合について簡 単に説明する。

[0025](1)光電流を自然対数的に変換して出 力する場合。

8

1、T2がサブスレッショルド領域で動作するようにバ イアスされているときの動作について、説明する。この とき、トランジスタT3のゲートに与えられる信号

のV RSがローレベルになっているので、トランジスタT3は OFFとなり、実質的に存在しないことと等価になる。 又、トランジスタT2に与えられる信号 ø D はハイレベ ル (直流電圧 VPDと同じ又は直流電圧 VPDに近い電位) とする。

【0026】図3の回路において、フォトダイオードP Dに光が入射すると光電流が発生し、トランジスタのサ ブスレッショルド特性により、前記光電流を自然対数的 に変換した値の電圧がトランジスタ T1, T2のゲート に発生する。この電圧により、トランジスタT2に電流 が流れ、キャパシタCには前記光電流の積分値を自然対 数的に変換した値と同等の電荷が蓄積される。つまり、 キャパシタCとトランジスタT2のソースとの接続ノー ドaに、前記光電流の積分値を自然対数的に変換した値 に比例した電圧が生じることになる。ただし、このと き、トランジスタT4はOFFの状態であるとする。

【0027】次に、トランジスタT4のゲートにパルス キャパシタCに蓄積された電荷が、出力電流として出力 信号線10に導出される。この出力信号線10に導出さ れる電流は前記光電流の積分値を自然対数的に変換した 値となる。このようにして入射光量の対数値に比例した 信号(出力電流)を読み出すことができる。信号を読み 出した後、トランジスタT4をOFFとするとともに信 号 ø D をローレベル (信号 ø VPSよりも低い電位) にし てトランジスタT2を通して信号øDの線路へキャパシ 夕Cに蓄積された電荷を放電することによって、キャパ シタC及び接続ノードaの電位が初期化される。このよ うな動作を所定の時間間隔で繰り返すことにより、刻々 と変化する被写体像を広いダイナミックレンジで連続的 に撮像することができる。尚、このように入射光量を自 ルのままであり、トランジスタT3はOFF状態となっ ている。

【0028】(2) 光電流を線形的に変換して出力す る場合。

て説明する。このとき、トランジスタT1のソース側の ポテンシャルが高くなる。よって、トランジスタT1は 実質的にOFF状態となり、トランジスタT1のソース ・ドレイン間に電流が流れない。又、トランジスタT3 50 ンジスタT3をOFFにしておく。

50

【0029】そして、まず、トランジスタT4をOFF するとともに信号 ø D をローレベル (信号 ø VPSよりも 低い電位)にするとキャパシタ Cの電荷がトランジスタ T2を通して信号 ØDの線路へ放電され、それによって キャパシタCをリセットして、接続ノードaの電位を例 えば直流電圧VPDより低い電位に初期化する。この電位 イレベル (直流電圧 VPDと同じ又は直流電圧 VPDに近い 電位) に戻す。このような状態において、フォトダイオ ードPDに光が入射すると光電流が発生する。このと き、トランジスタT1のバックゲートとゲートとの間や フォトダイオードPDの接合容量などでキャパシタを構 成するので、光電流による電荷が主としてトランジスタ T1, T2のゲートに蓄積される。よって、トランジス タT1, T2のゲート電圧が前記光電流を積分した値に 比例した値になる。

【0030】今、接続ノードaの電位が前記初期化により直流電圧VPDより低くなっているので、トランジスタT2はONし、トランジスタT2のゲート電圧に応じたドレイン電流がトランジスタT2を流れ、トランジスタT2のゲート電圧に比例した量の電荷がキャパシタCに蓄積される。よって、接続ノードaの電位が前記光電流を積分した値に比例した値になる。次に、トランジスタT4のゲートにパルス信号 ØVを与えて、トランジスタT4をONにすると、キャパシタCに蓄積された電荷が、出力電流として出力信号線10に導出される。この出力電流は前記光電流の積分値を線形的に変換した値となる。

【0031】このようにして入射光量に比例した信号 (出力電流)を読み出すことができる。又、この後、トランジスタT4をOFFとするとともに信号 $\phi$ DをローレベルにしてトランジスタT2を通して信号 $\phi$ Dの線路へ放電することによって、キャパシタ C及び接続ノード aの電位が初期化される。しかる後、トランジスタT3のゲートにハイレベルの信号 $\phi$ VRSを与えることで、トランジスタT3をONにして、フォトダイオードPD、トランジスタT1のドレイン電圧及びトランジスタT10ドレイン電圧及びトランジスタT11,T2のゲート電圧を初期化させる。このような動作を所定の時間間隔で繰り返すことにより、刻々と変化する被写体像をS/N比の良好な状態で連続的に撮像することができる。

【0032】このように、図3に示す画素は、簡単な電位操作により同一の画素で光電変換出力特性を切り換えることが可能になる。尚、信号を対数変換して出力する状態から線形変換して出力する状態に切り換える際には、まず ø VPSの電位調整により出力の切り換えを行ってから、トランジスタT3によるトランジスタT1などのリセットを行うことが好ましい。一方、信号を線形変換して出力する状態に切り換える際には、トランジスタT3によるトランジスタ

T1などのリセットは特に必要ない。これは、トランジスタT1が完全なOFF状態ではないことに起因してトランジスタT1に蓄積されたキャリアは逆極性のキャリアによってうち消されるためである。

10

【0033】又、エリアセンサ3の構成の別の例について、図4を参照して説明する。同図において、 $G11\sim G$ mnは行列配置(マトリクス配置)された画素を示している。7は垂直走査回路であり、行(ライン)9-1、9-2、・・、9-nを順次走査していく。8は水平走査回路であり、画素から出力信号線10-1、10-2、・・、10-mに導出された光電変換信号を画素ごとに水平方向に順次読み出す。11は電源ラインである。各画素に対し、上記ライン9-1、9-2・・・、9-nや出力信号線10-1、10-2・・・、10-m、電源ライン11だけでなく、他のライン(例えば、クロックラインやバイアス供給ライン等)も接続されるが、図4ではこれらについて省略する。

【0034】出力信号線10-1、 $10-2 \cdot \cdot \cdot \cdot$ 、10-mごとにNチャネルのMOSトランジスタQ1、Q2、・・・、Qm及びNチャネルのMOSトランジスタQa1、Qa2、・・・、Qamが図示の如く1組ずつ設けられている。トランジスタQa1、Qa2、・・・、Qamのゲートは直流電圧線13に接続され、ドレインはそれぞれ出力信号線10-1、 $10-2 \cdot \cdot \cdot \cdot$ 、10-mに接続され、ソースは直流電圧VPS のライン14に接続されている。一方、トランジスタQ1、Q2、・・・、Qmのドレインはそれぞれ出力信号線10-1、 $10-2 \cdot \cdot \cdot \cdot$ 、10-mに接続され、ソースは最終的な信号線12に接続され、ゲートは水平走査回路100 を記録

【0035】画素G11~Gmnには、後述するように、 それらの画案で発生した光電荷に基づく信号を出力する Nチャネルの第5MOSトランジスタT5が設けられて いる。トランジスタT5とトランジスタQa(このトラ ンジスタQaは、図4のトランジスタQa1~Qamに 対応する。)との接続関係は図5(a)のようになる。 ここで、トランジスタQaのソースに接続される直流電 圧VPS'と、トランジスタT5のドレインに接続される 直流電圧 VPD'との関係は VPD'> VPS'であり、直流 電圧 VPS'は例えばグランド電圧(接地)である。この 回路構成は上段のトランジスタT5のゲートに信号が入 カされ、下段のトランジスタQaのゲートには直流電圧 D Cが常時印加される。このため下段のトランジスタ Q aは抵抗又は定電流源と等価であり、図5 (a)の回路 はソースフォロワ型の増幅回路となっている。この場 合、トランジスタT5から増幅出力されるのは電流であ ると考えてよい。

【0036】トランジスタQ(このトランジスタQは、図4のトランジスタQ1~Qmに対応する。) は水平走 査回路8によって制御され、スイッチ素子として動作す

る。尚、後述するように図6の画素内にはスイッチ用のNチャネルの第4MOSトランジスタT4も設けられている。このトランジスタT4も含めて表わすと、図5

(a) の回路は正確には図5 (b) のようになる。即ち、トランジスタT4がトランジスタQaとトランジスタT5との間に挿入されている。ここで、トランジスタT4は行の選択を行うものであり、トランジスタQは列の選択を行うものである。

【0037】図5のように構成することにより信号のゲインを大きく出力することができる。従って、画素がダイナミックレンジ拡大のために感光素子から発生する光電流を自然対数的に変換しているような場合は、そのままでは出力信号が小さいが、本増幅回路により充分大きな信号に増幅されるため、後続の信号処理回路(図示せず)での処理が楽になる。また、増幅回路の負荷抵抗部分を構成するトランジスタQaを画素内に設けずに、列方向に配置された複数の画素が接続される出力信号線10-1、10-2、・・・、10-mごとに設けることにより、負荷抵抗又は定電流源の数を低減でき、半導体チップ上で増幅回路が占める面積を少なくできる。

【0038】図4に示した構成のエリアセンサ3の各画素の一例について、図6を参照して説明する。尚、図3に示す画素と同様の目的で使用される素子及び信号線などは、同一の符号を付して、その詳細な説明は省略する。

【0039】図6に示す画素は、図3に示す画素に、接続ノード $\alpha$ にゲートが接続され接続ノード $\alpha$ にかかる電圧に応じた電流増幅を行う第5 MOSトランジスタT5 と、このトランジスタT5のソースにドレインが接続された行選択用の第4 MOSトランジスタT4 と、接続ノード $\alpha$ にドレインが接続されキャパシタC 及び接続ノード $\alpha$ の電位の初期化を行う第6 MOSトランジスタT4 のとか付加された構成となる。トランジスタT4 のソースは出力信号線10 (この出力信号線10 は図4 の10 ー1、10 -2、・・・、10 -mに対応する)へ接続されている。尚、トランジスタT4 ~T6 も、トランジスタT1 ~T3 と同様に、N チャネルのM OSトランジスタでバックゲートが接地されている。

【0040】又、トランジスタT2,T5のドレインには直流電圧 VPDが印加され、トランジスタT4のゲートには信号 φ Vが入力される。又、トランジスタT6のソースには直流電圧 VRB2が印加されるとともに、そのゲートには信号 φ VRS2が入力される。尚、本実施形態において、トランジスタT1~T3及びキャバシタCは、図3に示す画素内の各素子と同様の動作を行い、信号 φ VPSの電圧値を切り換えてトランジスタT1のバイアスを変えることにより、出力信号線10に導出される出力信号を光電流に対して自然対数的に変換させる場合と、線形的に変換させる場合とを実現することができる。以下これらの各場合における動作を説明する。

12 【0041】(1) 光電流を自然対数的に変換して出 力する場合。

まず、信号 $\phi$  VPSをローレベルとし、トランジスタT 1, T 2 がサブスレッショルド領域で動作するようにバイアスされているときの動作について、説明する。このとき、トランジスタT 3 のゲートには、第1の実施形態と同様にローレベルの信号 $\phi$  VRSが与えられるので、トランジスタT 3 はOFFとなり、実質的に存在しないことと等価になる。

10 【0042】フォトダイオードPDに光が入射すると光電流が発生し、トランジスタのサブスレッショルド特性により、前記光電流を自然対数的に変換した値の電圧がトランジスタT1,T2のゲートに発生する。この電圧により、トランジスタT2に電流が流れ、キャパシタCには前記光電流の積分値を自然対数的に変換した値と同等の電荷が蓄積される。つまり、キャパシタCとトランジスタT2のソースとの接続ノードaに、前記光電流の積分値を自然対数的に変換した値に比例した電圧が生じることになる。ただし、このとき、トランジスタT4,20 T6はOFF状態である。

【0043】次に、トランジスタT4のゲートにパルス信号を与えて、トランジスタT4をONにすると、トランジスタT5のゲートにかかる電圧に比例した電流がトランジスタT4, T5を通って出力信号線10に導出される。今、トランジスタT5のゲートにかかる電圧は、接続ノードaにかかる電圧であるので、出力信号線10に導出される電流は前記光電流の積分値を自然対数的に変換した値となる。

【0044】このようにして入射光量の対数値に比例した信号(出力電流)を読み出すことができる。信号読み出し後はトランジスタT4をOFFにするとともに、トランジスタT6のゲートにハイレベルの信号 ØVRS2を与えることでトランジスタT6をONとして、キャパシタC及び接続ノードaの電位を初期化させることができる。尚、このように入射光量に対してその出力電流を自然対数的に変換する場合、信号 ØVRSは、常にローレベルのままである。

【0045】(2) 光電流を線形的に変換して出力する場合。

40 次に、信号 Ø VPSをハイレベルとしたときの動作について説明する。このとき、トランジスタ T 3 のゲートにローレベルの信号 Ø VRSを与えて、トランジスタ T 3 は O F F とする。そして、まず、トランジスタ T 6 のゲートにハイレベルの信号 Ø VRS2を与えて該トランジスタ T 6をONすることによりキャパシタ Cをリセットするとともに、接続ノード a の電位を直流電圧 VPDより低い電位 VRB2に初期化する。この電位はキャパシタ Cによって保持される。その後、信号 Ø VRS2をローレベルとして、トランジスタ T 6をOFFとする。このような状態 において、フォトダイオード P D に光が入射すると光電

流が発生する。このとき、トランジスタT1のバックゲートとゲートとの間やフォトダイオードPDの接合容量でキャパシタを構成するので、光電流による電荷がトランジスタT1のゲート及びドレインに蓄積される。よって、トランジスタT1, T2のゲート電圧が前記光電流を積分した値に比例した値になる。

【0046】今、接続ノードaの電位が直流電圧 VPDより低いので、トランジスタT2はONし、トランジスタT2のゲート電圧に応じたドレイン電流がトランジスタT2を流れ、トランジスタT2のゲート電圧に比例した10量の電荷がキャパシタ Cに蓄積される。よって、接続ノードaの電位が前記光電流を積分した値に比例した値になる。次に、トランジスタT4のゲートにバルス信号を与えて、トランジスタT4をONにすると、トランジスタT5のゲートにかかる電圧に比例した電流がトランジスタT4,T5を通って出力信号線10に導出される。トランジスタT5のゲートにかかる電圧は、接続ノードaの電圧であるので、出力信号線10に導出される電流は前記光電流の積分値を線形的に変換した値となる。

【0047】このようにして入射光量に比例した信号 (出力電流)を読み出すことができる。信号読み出し後は、まず、トランジスタT4をOFFにするとともに、トランジスタT3のゲートにハイレベルの信号 Ø VRSを与えることで、トランジスタをONとして、フォトダイオードPD、トランジスタT1のドレイン電圧、及びトランジスタT1,T2のゲート電圧を初期化させる。次に、トランジスタT6のゲートにハイレベルの信号 Ø VRS2を与えることでトランジスタT6をONとして、キャパシタC及び接続ノードaの電位を初期化させる。

【0048】又、各画素からの信号読み出しは電荷結合素子(CCD)を用いて行うようにしてもかまわない。この場合、図3又は図6のトランジスタT4に相当するポテンシャルレベルを可変としたポテンシャルの障壁を設けることにより、CCDへの電荷読み出しを行えばよい。

【0049】次に、自動感度調整回路4の詳細について、図7を参照して説明する。自動感度調整回路4は、エリアセンサ3より送出される輝度信号より被写体の輝度を検知するプロセッサ41と、プロセッサ41よりコントロール信号を受けてエリアセンサ3の受光時間を変更するタイミングジェネレータ42とを有する。又、対物レンズ2内には、アイリス22が設けられ、このアイリス22がプロセッサ41によりコントロール信号を受けてその絞りを変更する。更に、エリアセンサ3内の各画素からの出力を増幅して処理部20に出力するためのアンプ31がエリアセンサ3の出力側に設けられ、このアンプ31にもプロセッサ41よりコントロール信号が与えられる。

【0050】この自動感度調整回路4は、エリアセンサ 3より輝度信号をプロセッサ41が受けると、まず、こ の輝度信号より被写体の輝度を検出する。次に、プロセッサ41が被写体の輝度を検出すると、その輝度に応じてアイリス22、アンプ31、タイミングジェネレータ42にコントロール信号を与える。このようなコントロール信号が与えられるアイリス22、アンプ31、タイミングジェネレータ42について、それぞれの動作を以下に示す。尚、図1には、アンプ31、アイリス22、及び自動感度調整回路4からアンプ31、アイリス22への信号線は図示省略している。

14

10 【0051】まず、アイリス22は、被写体の輝度が明るくなるとエリアセンサ3に与えられる光量が増加してエリアセンサ3内の各画素が飽和状態になりやすくなるため、狭く絞られてエリアセンサ3に与えられる光量を減少させる。次に、アンプ31は、被写体の輝度が暗くなるとエリアセンサ3内の各画素からの出力が小さくなり階調性が悪くなるため、その出力のゲインを大きくして階調性を高める。最後に、タイミングジェネレータ42は、被写体の輝度が暗くなるとエリアセンサ3に与えられる光量が減少して出力が得られるのに充分な光量に20 満たないことがあるため、エリアセンサ3内の各画素の積分時間を長くして出力するのに充分な光量が与えられるようにする。尚、輝度信号としては、例えば、エリアセンサ3の特定画素の出力をそのまま用いることができる。又、複数の画素出力の平均出力を用いても良い。

【0052】上記した図3のような画素を設けた図2のような構成のエリアセンサ又は図6のような画素を設けた図4のような構成のエリアセンサをエリアセンサ3に用いたときの固体撮像装置1の動作について、図1及び図8を参照して以下に説明する。但し、図8では処理部20及び自動感度調整回路4を図示省略している。図1に示す固体撮像装置1は、エリアセンサ3が対数変換動作を行うか線形変換動作を行うかの切換点を、切換判定回路5が検知する被写体の輝度で略700[cd/m²]という値にする理由を以下に説明する。

【0053】まず、エリアセンサ3を対数変換動作させるときは、高輝度の階調性が乏しくなるが、幅広い輝度範囲の被写体を撮像可能である。そのため、概して輝度範囲の広い被写体が明るいときに有効で特に直射日光が被写体に当たっているか、又は直射日光が被写体の背景に存在する場合に用いると、影になっている部分の描写も十分に行われるので、奥行きのある高品位の画像を撮像することが可能である。このような被写体の明るいときの輝度は、略1000 [cd/m²]である。

【0054】次に、エリアセンサ3を線形変換動作させるときは、幅広い輝度範囲の被写体の撮像が不可能となるが、画像全体の階調性が豊かである。そのため、概して輝度範囲の狭い被写体が暗いときに有効で特に被写体が日陰に存在するか、又は曇天に被写体を撮像する場合に用いると、階調性豊かな高品位の画像を撮像すること

50

が可能である。このような被写体の暗いときの輝度は、略500 [cd/ $m^2$ ]である。よって、直射日光が入る明るいときにはエリアセンサ3を対数変換動作させ、又、直射日光が入らない暗いときにはエリアセンサ3を線形変換動作させるために、その切換点を被写体の輝度が700 [cd/ $m^2$ ]の点に設定するのが好ましいといえる。

【0055】(A)明るい状況で被写体を撮像するとき 図8(a)のように、直射日光を受けた被写体50を撮 像するとき、エリアセンサ3より輝度信号が切換判定回 路5に送出され、この切換判定回路5により700 [c d/m<sup>2</sup>] 以上の輝度(例えば1000 [cd/m<sup>2</sup>]) が検出される。よって、切換判定回路5はエリアセンサ 3を対数変換動作させるべきであると判定する。この判 定信号を受けた切換信号発生回路6は、 ØVPS (図3又 は図6)をローレベルとする切換信号を発生する。この 切換信号により、画素内のトランジスタ T1 (図3又は 図6)のソース及びキャパシタC(図3又は図6)にか かる電圧がローレベルとなって、上記したように、トラ ンジスタT1、T2(図3又は図6)がサブスレッショ ルド領域で動作するようにバイアスされ、エリアセンサ 3から対数変換された電気信号が出力信号線10(図3 又は図6)及び最終的な信号線12(図2又は図4)を 介して画像データとして処理部20に送出される。この ように送出された画像データを処理部20で演算処理を 行い、ファインダー21に撮像した画像を映し出す。

【0056】(B)暗い状況で被写体を撮像するとき 図8 (b) のように、 曇天などのときに直射日光が遮ら れた被写体50を撮像するとき、エリアセンサ3より輝 度信号が切換判定回路5に送出され、この切換判定回路 5により700 [cd/m<sup>2</sup>] 以下の輝度 (例えば、5 00 [cd/m<sup>2</sup>]) が検出される。よって、切換判定 回路5はエリアセンサ3を線形変換動作させるべきであ ると判定する。この判定信号を受けた切換信号発生回路 6は、 Ø VPS (図3又は図6) をハイレベルとする切換 信号を発生する。この切換信号により、画素内のトラン ジスタT1 (図3又は図6) のソースにかかる電圧がハ イレベルとなって、上記したように、トランジスタT1 が実質的にOFF状態となり、エリアセンサ3から線形 変換された電気信号が出力信号線10(図3又は図6) 及び最終的な信号線12(図2又は図4)を介して画像 データとして処理部20に送出される。このように送出 された画像データを処理部20で演算処理を行い、ファ インダー21に撮像した画像を映し出す。

【0057】このように切換判定回路5では、エリアセンサ3から自動感度調整回路4に送出される輝度信号によって、エリアセンサ3の変換動作を判定する事ができる。尚、エリアセンサ3の変換動作が線形変換動作、対数変換動作のどちらの場合でも、自動感度調整回路4は動作している。よって、変換動作が切り替わるときにフ

16 アインダー21などに違和感無く画像を映し出すことが できる。

【0058】 <第2の実施形態>第2の実施形態について、図面を参照して説明する。図9は、本実施形態で使用する固体撮像装置の内部構造を示すブロック図である。尚、図1に示す固体撮像装置と同様の目的で使用する部分については、同一の符号を付してその詳細な説明は省略する。

【0059】図9の固体撮像装置1、における切換判定 回路5'は、図1の切換判定回路5のように自動感度調 整回路 4 に入力される輝度信号が入力されずに、エリア センサ3からの画像データが入力される。又、この切換 判定回路5'は、図1の切換判定回路5のように被写体 の輝度のみを検知するのではなく、エリアセンサ3から の画像データより、被写体の輝度範囲が検知される。 又、エリアセンサ3は、第1の実施形態と同様に上記し た図3のような画素を設けた図2のような構成のエリア センサ又は図6のような画素を設けた図4のような構成 のエリアセンサである。尚、図9において、図1と同 様、アイリス22、アンプ31、及び自動感度調整回路 4からアイリス22、アンプ31への信号線は図示省略 している。又、自動感度調整回路4は、図7に示す自動 感度調整回路4と同様の構成であるとともに、第1の実 施形態で説明した動作と同様の動作を行う。

【0060】まず、被写体の輝度範囲の検知方法について、固体撮像装置1'をビデオムービーとして説明する。現在、ビデオムービーなどでは、1秒間に30コマの画像を記録している。そこで、例えば1秒間に1コマずつというように、所定の間隔で、エリアセンサ3を強制的に対数変換動作を行わせて、このとき、エリアセンサ3から切換判定回路5'に送出される1コマ分の画像データにより被写体の輝度範囲を検知することができる。このようにして得られる被写体の輝度範囲によって、エリアセンサ3に線形変換動作をさせるか、対数変換動作をさせるか判定する。

【0061】次に、このような固体撮像装置1,の動作について、図9及び図10を参照して以下に説明する。 尚、図10では処理部20及び自動感度調整回路4は図示省略している。図9に示す固体撮像装置1,は、エリアセンサ3が対数変換動作を行うか線形変換動作を行うかの切換点を、被写体の輝度範囲が例えば2.5桁となるような点に設定する。

【0062】ところで、まず、エリアセンサ3を対数変換動作させるときは、高輝度の階調性が乏しくなるが、幅広い輝度範囲の被写体の撮像が可能である。そのため、被写体が明るくその輝度範囲が3~4桁程度と広いときに有効で、特に直射日光が被写体に当たっているか、又は直射日光が被写体の背景に存在する場合に用いると、影になっている部分の描写も十分に行われるので、奥行きのある高品位の画像を撮像することが可能で

20

ある。

【0063】次に、エリアセンサ3を線形変換動作させるときは、幅広い輝度範囲の被写体の撮像が不可能となるが、画像全体の階調性が豊かである。そのため、被写体が暗くその輝度範囲が2桁程度と狭いときに有効で、特に被写体が日陰に存在するか、又は曇天に被写体を撮像する場合に用いると、階調性豊かな高品位の画像を撮像することが可能である。

【0064】(A) 明るい状況で被写体を撮像するとき図10(a)のように、直射日光を受けた被写体50を撮像するとき、エリアセンサ3が、所定の間隔毎に、1コマ分の対数変換した画像データを切換判定回路5,に送出する。この切換判定回路5,では、エリアセンサ3から1コマ分の画像データが送出される際に各画素から送出される電気信号の信号レベルの大小を順次比較して、その最大値と最小値を検知する。更に、このようにして検知した信号レベルの最大値と最小値の差が基準値より大きいとき(被写体の輝度範囲が2.5桁以上あるとも)、被写体の輝度範囲が広いものと判定する。よって、切換判定回路5,によりエリアセンサ3を対数変換動作させるべきであると判定する。

【0065】この判定信号を受けた切換信号発生回路6 は、 ø VPS (図3又は図6)をローレベルとする切換信 号を発生する。この切換信号により、画素内のトランジ スタT1 (図3又は図6) のソース及びキャパシタC (図3又は図6) にかかる電圧がローレベルとなって、 上記したように、トランジスタT1,T2(図3又は図 6)がサプスレッショルド領域で動作するようにバイア スされ、エリアセンサ3から対数変換された電気信号が 出力信号線10 (図3又は図6) 及び最終的な信号線1 2 (図2又は図4)を介して処理部20に送出される。 このように送出された電気信号を処理部20で演算処理 を行い、ファインダー21に撮像した画像を映し出す。 【0066】(B)暗い状況で被写体を撮像するとき 図10 (b) のように、曇天などのときに直射日光が遮 られた被写体50を撮像するとき、エリアセンサ3が、 所定の間隔毎に、1コマ分の対数変換した画像データを 切換判定回路5'に送出する。この切換判定回路5'で は、エリアセンサ3から1コマ分の画像データが送出さ れる際に各画素から送出される電気信号の信号レベルの 40 大小を順次比較して、その最大値と最小値を検知する。 更に、このようにして検知した信号レベルの最大値と最 小値の差が基準値より小さいとき(例えば、被写体の輝 度範囲が2.5桁より狭いとき)、被写体の輝度範囲が **狭いものと判定する。よって、切換判定回路5'により** エリアセンサ3を線形変換動作させるべきであると判定

【0067】この判定信号を受けた切換信号発生回路6は、 Ø VPS (図3又は図6)をハイレベルとする切換信号を発生する。この切換信号により、画素内のトランジ

する。

スタT1(図3又は図6)のソースにかかる電圧がハイレベルとなって、上記したように、トランジスタT1(図3又は図6)が実質的にOFF状態となり、エリアセンサ3から線形変換された電気信号が出力信号線10(図3又は図6)及び最終的な信号線12(図2又は図4)を介して処理部20に送出される。このように送出された電気信号を処理部20で演算処理を行い、ファインダー21に撮像した画像を映し出す。

18

【0068】尚、エリアセンサ3が対数変換動作を行っているときは、所定の間隔毎に1コマ分の画像データを切換判定回路5,に送出させる。又、エリアセンサ3が線形変換動作を行っているときは、所定の間隔毎にエリアセンサ3に対数変換動作を行わせるとともに、そのとき得られた画像データを切換判定回路5,に送出させた後、切り換える必要がなければ、エリアセンサ3は線形変換動作に戻る。

【0069】又、本実施形態では、エリアセンサが線形変換動作を行っているときも強制的に対数変換動作を行わせて得られた1コマ分の画像データに基づいて、被写体の輝度範囲を求めているが、エリアセンサが線形変換動作を行っているとき、所定の間隔毎に得られる画像データのうち飽和したデータの数量によって、その輝度範囲を求めて、切換判定を行うようにしても良い。即ち、エリアセンサが線形変換動作を行っているとき、飽和したデータが所定値より多い場合、白トビ又は黒ツブレが多く発生するものと考えられるので、エリアセンサの変換動作を対数変換動作に切り換える。

【0070】更に、第1の実施形態と同様に、エリアセンサ3の変換動作が線形変換動作、対数変換動作のどちらの場合でも、自動感度調整回路4を動作させることによって、変換動作が切り替わるときにファインダー21などに違和感無く画像を映し出すことができる。

【0071】第1及び第2の実施形態では、図2のような構成のエリアセンサにおいて、図3のような回路構成の画素を用いて説明したが、このような回路構成の画素以外に、例えば、図11又は図12に示すような回路構成の画素を用いてもかまわない。ここで、図11の画素の構成について、以下に説明する。尚、図3に示す画素と同様の目的で使用される素子及び信号線などは、同一の符号を付して、その詳細な説明は省略する。

【0072】図11に示す画素は、図3に示す画素のように、トランジスタT1のドレインとゲートを接続せずに、ソースとゲートを接続するようにしている。まず、光電流を対数変換して出力するときの画素の動作について説明する。トランジスタT1のソース・ドレイン間の電圧差を大きくして、ゲート・ソース間に発生する電圧をスレッショルド電圧より小さくする。このようにすることによって、トランジスタT1がサブスレッショルド領域で動作するようにバイアスされているときと同様の状態とする。よって、フォトダイオードPDより発生す

る光電流を対数変換して出力することができる。

【0073】次に、光電流を線形変換して出力するときの画素の動作について説明する。このときは、トランジスタT1のソースに印加する信号 Ø VPSを直流電圧 VPDより若干低い電位にすることによって、トランジスタT1を実質的にカットオフ状態とする。よって、トランジスタT1のソース・ドレイン間に電流が流れない。その後の動作については、図3に示す画素と同様である。

【0074】次に、図12の画素の構成について、以下に説明する。尚、図11に示す画素と同様の目的で使用される素子及び信号線などは、同一の符号を付して、その詳細な説明は省略する。

【0075】図12に示す画素では、トランジスタT1 のゲートが直流電圧VRGを印加される。その他の回路構 成については、図11に示す画素内の回路構成と同様で ある。このような構成の画素を用いたとき、その動作は 本質的には図11に示す画素と同様である。しかし、図 11の画素と異なりトランジスタ T1のゲート電圧を適 切な電圧に設定できるので、対数変換動作を行うとき する必要がなく、ある程度低い電圧とすることによっ て、トランジスタT1をサブスレッショルド領域でバイ アスしたときと同様の状態にすることができる。又、線 形変換動作を行うときは、図11の画素と同様である。 【0076】又、第1及び第2の実施形態では、図4の ような構成のエリアセンサにおいて、図6のような回路 構成の画素を用いて説明したが、このような回路構成の 画素以外に、例えば、図13又は図14に示すような回 路構成の画素を用いてもかまわない。ここで、図13の 画素の構成について、以下に説明する。尚、図6に示す 画素と同様の目的で使用される素子及び信号線などは、 同一の符号を付して、その詳細な説明は省略する。

【0077】図13に示す画素は、図6に示す画素のように、トランジスタT1のドレインとゲートを接続せずに、ソースとゲートを接続するようにしている。まず、光電流を対数変換して出力するときの画素の動作について説明する。トランジスタT1のソース・ドレイン間の電圧差を大きくして、ゲート・ソース間に発生する電圧をスレッショルド電圧より小さくする。このようにすることによって、トランジスタT1がサブスレッショルド領域で動作するようにバイアスされているときと同様の状態とする。よって、フォトダイオードPDより発生する光電流を対数変換して出力することができる。

【0078】次に、光電流を線形変換して出力するときの画素の動作について説明する。このときは、トランジスタT1のソースに印加する信号 Ø VPSを直流電圧 VPDより若干低い電位にすることによって、トランジスタT1を実質的にカットオフ状態とする。よって、トランジスタT1のソース・ドレイン間に電流が流れない。その後の動作については、図6に示す画素と同様である。

【0079】次に、図14の画素の構成について、以下に説明する。尚、図13に示す画素と同様の目的で使用される素子及び信号線などは、同一の符号を付して、その詳細な説明は省略する。

20

【0080】図14に示す画素では、トランジスタT1 のゲートが直流電圧VRGを印加される。その他の回路構 成については、図13に示す画素内の回路構成と同様で ある。このような構成の画素を用いたとき、その動作は 本質的には図13に示す画素と同様である。しかし、図 13の画素と異なりトランジスタT1のゲート電圧を適 切な電圧に設定できるので、対数変換動作を行うとき に、図13の画素のように、 ØVPSを十分に低い電圧と する必要がなく、ある程度低い電圧とすることによっ て、トランジスタT1をサブスレッショルド領域でバイ アスしたときと同様の状態にすることができる。又、線 形変換動作を行うときは、図13の画素と同様である。 【0081】更に、本発明で使用する画素は、1つの画 素で対数変換動作及び線形変換動作を行うことが可能で あればよく、例えば、図3、図6、図11、図12、図 13又は図14の画素のキャパシタを省略するような回 路構成の画素を用いてもかまわない。又、対数変換動作 及び線形変換動作が切換可能な画素であれば、その回路 構成はこれらの回路構成に限定されるものではない。 【0082】又、エリアセンサについても、図2又は図 4のような構成のエリアセンサを用いて説明したが、こ のような構成のエリアセンサに限定されるものでなく、 例えば、エリアセンサ内に設けられたMOSトランジス タがPチャネルのMOSトランジスタであるような他の

30 [0083]

構成のエリアセンサでも良い。

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、入射光に対し電気信号を対数変換するか線形変換するかを、撮像を行う固体撮像素子の出力に基づいて切り換えるようにした。そのため、被写体の明るさの状態にかかわらず常に良好な撮像を行うことが可能となり、例えば、明るい状況下にある被写体を撮像するときは、広い輝度範囲を撮像できるように固体撮像素子を対数変換動作を行わせ、又、暗い状況下にある被写体を撮像するときは、階調性良く撮像できるように固体撮像素子を線形変換動作を行わせることができる。又、固体撮像素子からの電気信号を用いて固体撮像素子の動作状態を自動的に切り換えるので、被写体の輝度などを測定するためのセンサーを新たに設ける必要がなく、構成が簡単になる。

【0084】又、感度調整を行う感度調整部に送出する 輝度信号を固体撮像素子の動作状態を切り換えるための 判断材料とすることによって、通常より使用されている 感度調整部に送出する輝度信号が用いられているので、 被写体の輝度を判定するための信号を新たに生成する必 50 要がない。 【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施形態の固体撮像装置の内部構造を示すプロック図。

【図2】本発明の固体撮像装置に用いられるエリアセンサの内部構造の1例。

【図3】図2に示すエリアセンサ内に設けられた画素の 回路構成の1例。

【図4】本発明の固体撮像装置に用いられるエリアセンサの内部構造の1例。

【図5】図4の一部の回路図。

【図6】図4に示すエリアセンサ内に設けられた画素の回路構成の1例。

【図7】自動感度調整回路とその周辺部の構成を示す図。

【図8】図1に示す固体撮像装置を用いて撮像するときの被写体の状況を示す図。

【図9】第2の実施形態の固体撮像装置の内部構造を示すプロック図。

【図10】図9に示す固体撮像装置を用いて撮像すると きの被写体の状況を示す図。

【図11】図2に示すエリアセンサ内に設けられた画素の回路構成の1例。

【図12】図2に示すエリアセンサ内に設けられた画素の回路構成の1例。

【図13】図4に示すエリアセンサ内に設けられた画素の回路構成の1例。

【図14】図4に示すエリアセンサ内に設けられた画素の回路構成の1例。

22

【図15】LOGセンサの出力特性を示す図。

【符号の説明】

- 1 固体撮像装置
- 2 対物レンズ
- 3 エリアセンサ (固体撮像素子)
- 4 自動感度調整回路
- 5 切換判定回路
- 10 6 切換信号発生回路
  - 7 垂直走查回路
  - 8 水平走査回路
  - 9 ライン
  - 10 出力信号線
  - 11 電源ライン
  - 12 信号線
  - 20 処理部
  - 21 ファインダー
  - 22 アイリス
- 20 31 アンプ
  - 41 プロセッサ
  - 42 タイミングジェネレータ

G11~Gmn 画素

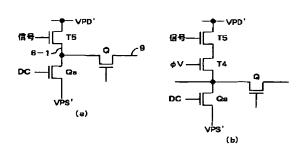
T1~T6 NチャネルのMOSトランジスタ

PD フォトダイオード

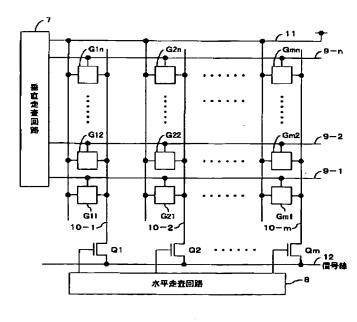
C キャパシタ

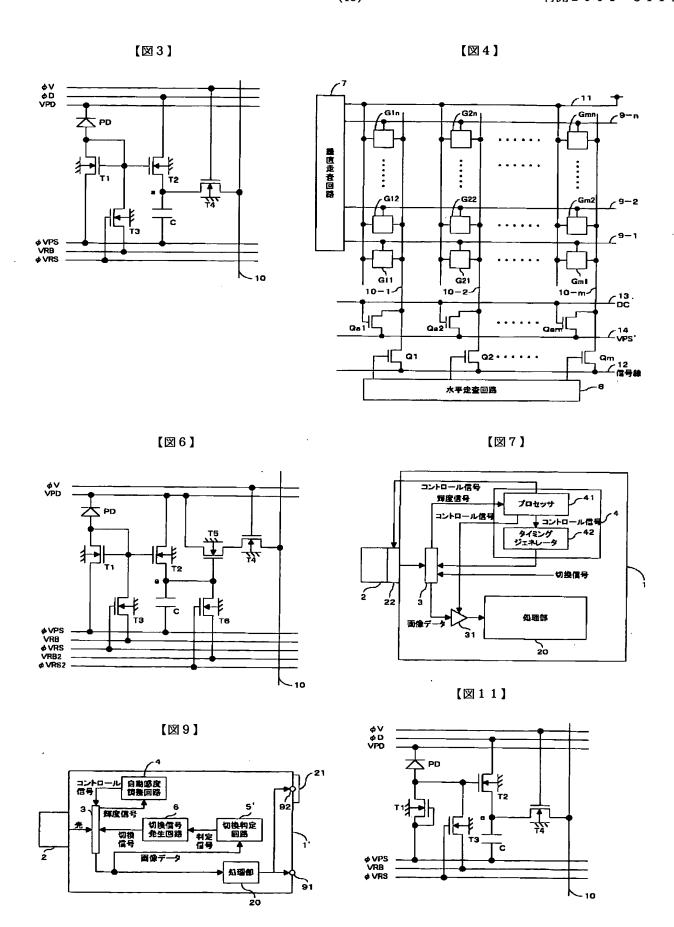
【図1】

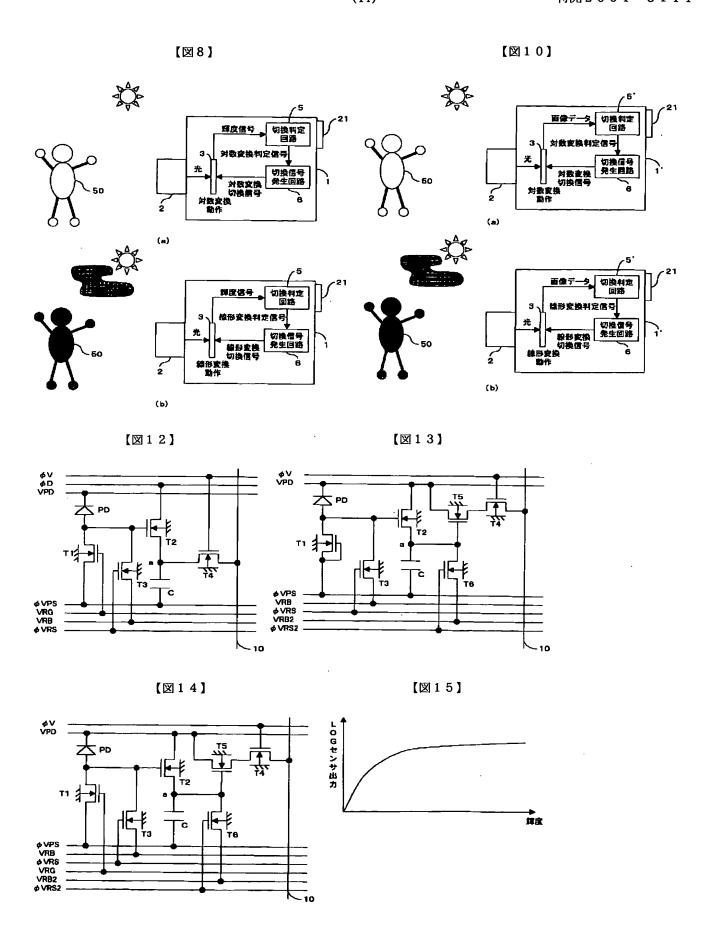
【図5】



【図2】







フロントページの続き

(72)発明者 草鹿 泰

大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪 国際ビル ミノルタ株式会社内 F ターム(参考) 4M118 AA02 AA10 AB01 BA14 CA03 DD12 FA06

5C024 AA01 CA15 FA01 FA11 GA31

HA18

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.